第一原理計算による III-V 族化合物-グラフェン超格子の構造および電子状態解析 Computational prediction for stable structures of graphene van der Waals superlattices composed of group-III-V compounds 三重大院工, O秋山亨, 河村貴宏, 伊藤智徳 Mie University, OToru Akiyama, Takahiro Kawamura, Tomonori Ito E-mail: akiyama@phen.mie-u.ac.jp

【はじめに】近年、グラフェン等のハニカム構造を持つ二次元原子層膜が特異な物性を持つ新材 料として注目されている。さらに、これら二次元原子層膜で構成されるvan der Waals (vdW)ヘテロ 構造もバルク状態では得られない特異な機能を持たせる系として注目されている[1]。一方、新た な二次元原子層膜として、III 族窒化物において分子線エピタキシャル成長法によってAg(111)基 板上にHex構造のAIN [2]が作製されており、他のIII 族窒化物でも第一原理計算によりその形成可 能性が示唆されている[3]。さらに、他のIII-V族およびII-VI族化合物半導体においては10原子層以 下の膜厚において2層ハニカム(DLHC)構造の形成が提案されている[4]。これまでに我々は、III-V 族およびII-VI族化合物における二次元原子層物質の構造安定性を決定し、DLHC構造の安定性は 化合物のイオン性と関係することを明らかにした[5]。本研究では、新たなvdWヘテロ構造の材料 探索として、III-V族化合物とグラフェン(およびh-BN)とのヘテロ構造の形成可能性の検討および 新規物性探索を行う。具体的には、密度汎関数計算にもとづきIII-V族化合物(AIAs, AISb, GaAs, GaSb, InP, InAs)とグラフェン(およびh-BN)との超格子の安定構造の決定と電子状態の解析を行う。

【結果および考察】Fig. 1 は 2 分 子層からなる AlAs とグラフェン で構成される超格子(G/AlAs)の構 造および電子局在関数(Electron localization function, ELF)の断面図 を示したものである。Fig. 1(a)に示 す AlAs がバルク状態での安定構 造である閃亜鉛鉱(ZB)構造をとる 場合は、グラフェンと Al 原子との 間に化学結合が形成され二次元原 子層とはならないのに対し、Fig. 1(b)に示す DLHC 構造においては 化学結合は形成せず vdW 結合が 形成していることが考えれる。ま た、DLHC 構造での超格子の全エ ネルギーは Fig. 1(a)の ZB 構造の 超格子に比べて 0.91 eV/unit cell 低



Fig. 1 Calculated geometries and contour plots of electron localization function (ELF) for superlattices consisting of graphene and AlAs (G/AlAs) with (a) ZB and (b) DLHC structures obtained by GGA calculations with spin–orbit interactions. Contour values of ELF are ranging from blue (0.1) and red (1.0). Blue, green, brown circles denote Al, As, and C atoms, respectively.

くなり、結合エネルギーも-0.45 eV/unit cell となりグラフェンのそれと同程度となる。さらに他の III-V 族化合物においても同様の傾向が見られ、グラフェン(h-BN)と III-V 族化合物で構成される 超格子では III-V 族化合物として DLHC 構造をとる超格子がエネルギー的に安定で、フォノン分 散の評価から動力学的にも安定であることが解る。また、これら超格子のバンド構造を評価する と、対称性の低下によりグラフェンのデイラックコーンが消失してエネルギーギャップが生じ、 GaAs および InAs においては DLHC 構造に起因してバンド反転も起きる。以上の結果は、III-V 族 化合物による新たな vdW ヘテロ構造の実現可能性を示唆している。

【参考文献】[1] A. K. Geim and I. V. Grigorieva, Nature **499**, 419 (2013). [2] P. Tsipas *et al.*, Appl. Phys. Lett. **103**, 251605 (2013). [3] C. L. Freeman *et al.*, Phys. Rev. Lett. **96**, 066102 (2006). [4] M. C. Lucking *et al.* Phys. Rev. Lett. **120**, 086101 (2018). [5] T. Akiyama *et al.*, Appl. Phys. Express **12**, 125501 (2019).